



Dienstag, 12. Juli 2011

2011 IEEE International Symposium on EMC

GAUSS INSTRUMENTS auf dem IEEE EMC Symposium 2011. Techn. Session mit Schwerpunkt auf Zeitbereichs- verfahren (WED-PM-1, Raum 101A) - mit vier wissenschaftlichen Beiträgen von GAUSS INSTRUMENTS.

Treffen Sie die Erfinder des TDEMI[®] Zeitbereichsmesssystems und lernen Sie mehr über die neusten Trends in Forschung und Entwicklung im Bereich der Zeitbereichsmesstechnik und -verfahren in der Session 'Emissions 2' geleitet von Don Heirmann und Tom Fagan. Schwerpunkt der Session, welche in Konferenzraum 101A am Nachmittag des 17.08.2011 von 13:30 bis 17:30 Uhr stattfindet, ist Zeitbereichstechnologie in der EMV. Vier der Präsentationen werden von GAUSS INSTRUMENTS beigetragen.

Die Session beinhaltet insgesamt sieben Beiträge, die eine Einführung und detaillierte Einsichten in die Messung von elektromagnetischen Interferenzen und insbesondere die Anwendung von Zeitbereichsmethoden hierzu geben. Fortschrittliche Methoden für die Welt der modernen EMV-Untersuchungen werden vorgestellt, um Messungen von immer komplexer werdenden Produkten zu vereinfachen und Testdurchlaufzeiten zu verkürzen. Das IEEE EMC Society International Symposium und Industrieausstellung für EMV findet 2011 in Long Beach, California (US) zwischen 14. und 19. August statt. Die Titel der vier von GAUSS INSTRUMENTS Beiträge sind:

- Digital Automatic Calibration Method for a Time-Interleaved ADC System used in Time-Domain EMI Measurement Receiver
- A Novel Time-domain EMI Measurement System for Measurement and Evaluation of Discontinuous Disturbance According to CISPR 14 and CISPR 16
- Noise Cancelling Algorithms for FPGA-based Time-domain EMI Measurements in Real-time
- A Broadband High-Dynamic Time-Domain System for EMI Measurements in K-Band up to 26 GHz

Weitere Informationen zu den vorgestellten Themen sind im offiziellen [Programm zum Symposium](#) auf Seite 36 nachzulesen. Nutzen Sie die Gelegenheit um mehr über die neusten Technologien und Entwicklungen im Bereich der EMV zu erfahren und wie Sie durch deren Anwendung profitieren und nachhaltig die Durchführung von Messungen beschleunigen und Messunsicherheiten weiter reduzieren.

Für zusätzliche Informationen besuchen Sie die offizielle Webseite zur Konferenz:

<http://www.emc2011.org/>



Dienstag, 12. Juli 2011

2011 IEEE International Symposium on EMC